

SPECS™

МОДУЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

- ✓ Модульные аналитические системы SPM, XPS, PEEM/LEEM, ARPES, NAP-XPS, HAXPES, AES, MBE, UPS, SIMS
- ✓ Вакуумные компоненты: ионные, электронные, рентгеновские, УФ и плазменные источники

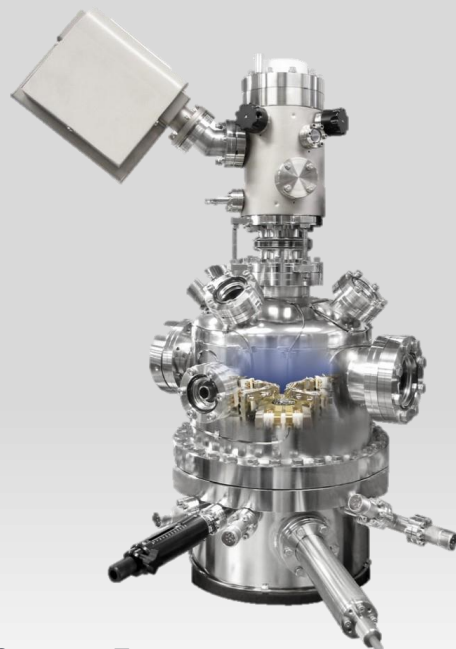


НАСТОЛЬНЫЙ СЭМ

- ✓ Ускоряющее напряжение: 5 кВ, 10 кВ, 15 кВ
- ✓ Увеличение (в пересчете на отпечаток 128 мм*96 мм): X10 – X100 000
- ✓ Режимы визуализации:
 - Режим высокого вакуума: вторичные электроны, обратно-рассеянные электроны (структура, топографическое или теневое изображения), 3D
 - Режим низкого вакуума: обратно-рассеянные электроны (структура, топографическое или теневое изображения), 3D

СВЕРХВЫСОКОВАКУУМНЫЕ СЭМ UNISOKU

- ✓ Рабочие температуры от 0.04 К до КТ
- ✓ Магнитное поле с индукцией до 15 Тл
- ✓ Давление $3 \cdot 10^{-8}$ Па
- ✓ Порты для дополнительных модулей (детектор дифракции, ионная пушка, колонна оптического и электронного микроскопов)
- ✓ Функции AFM, SEM, TERS, MBE, SP-STM
- ✓ Многозондовые СЭМ



SPECS™

TII
RUS

www.specs-tii.ru
info@specs-tii.ru
123 001, г. Москва, ул. Садовая Б., д. 5
Тел. +7 (495) 920 90 05